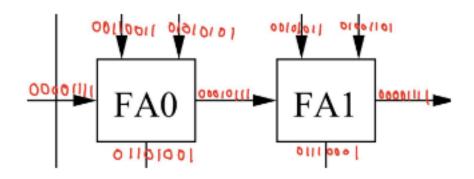
VLSI Testing HW1 - 11052167 曹寓恆

1. BIST

Method

首先觀察 RCA 輸入與輸出的關係,可以知道給定特定的 test pattern 可以使 Full Adder 每兩級組成一個測試循環,因此 16 級 RCA 可以切分成 8 個測試單元,分別對 X、Y 輸入相仿的序列,又因 Full Adder 總共的輸入可能組合有 8 種,所以測試集大小為 8。



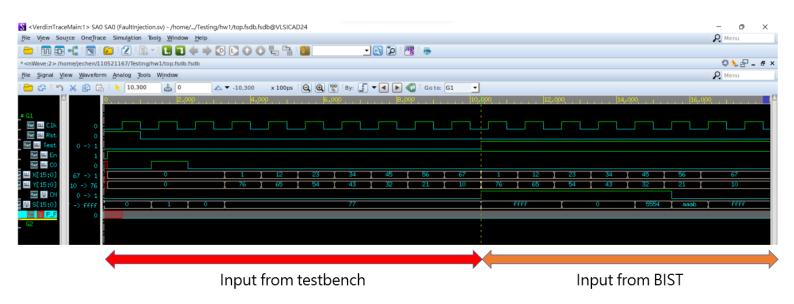
(圖一) 每兩級 CO 與 C2 會相同

Implementation & Simulation

• 對 fault-free 16 bits RCA 進行仿真,確認電路行為正確性

```
NBitsAdder #(.N(WORDLEN)) DUT_PASS(
    .x(x_mux),
    .y(y_mux),
    .c0(c0_mux),
    .sum(s_mux),
    .cn(cn_mux)
);
```

(圖二) DUT PASS



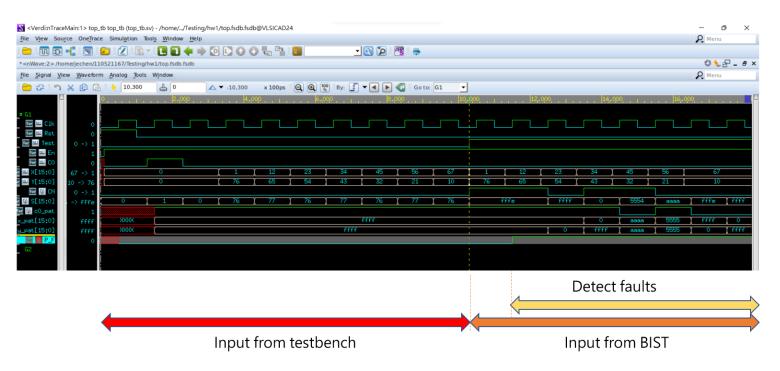
(圖三) DUT PASS waveform (P_F 恆為 0)

• 對 fault-free 16 bits RCA 進行仿真,確認電路行為正確性

```
SA0 _sa0 (
    .in(X[0]),
    .out(sa0)
);

NBitsAdder #(.N(WORDLEN)) DUT_FAIL(
    .x({x_mux[WORDLEN - 1:1], sa0}),
    .y(y_mux),
    .c0(c0_mux),
    .sum(s_mux),
    .cn(cn_mux)
);
```

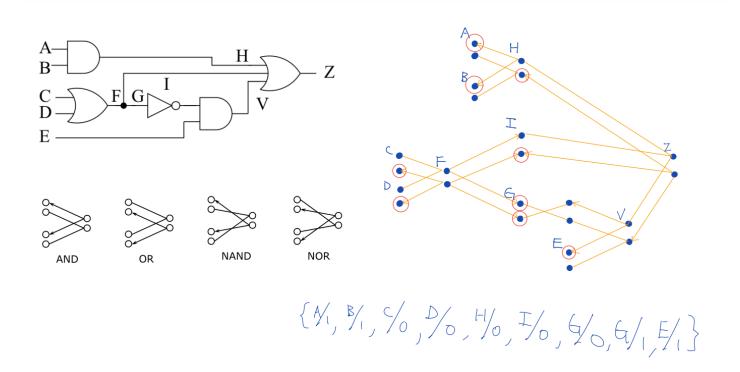
(圖三) DUT FAIL



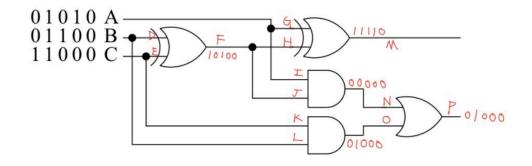
(圖四) DUT FAIL waveform (P_F 在 Test = 1的後一個週期開始檢查,並檢查出

16' hffff+16' hffff + 1' b1!= 16' hfffe, 因此 P_F 為 1)

2. Fault list



3. Find undetected stuck-at fault



Detected	A	8	C	\triangleright	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	\bigcirc	P
Stuck at O	$\sqrt{}$	\bigvee			V	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	X	X	\bigvee	V	V	X	V	V
Stuck at 1	\checkmark	\vee	/	\vee	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	/	V	V	$\sqrt{}$	\vee	/	V